



## 認 定 証

一般財団法人日本品質保証機構 殿

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、計量法校正事業者登録制度で登録された校正事業者であって、かつ、ILAC 及び APLAC の相互承認要求事項に適合する事業者として、以下のとおり認定します。

認 定 番 号 J C S S 0 1 0 4

事業所の名称 一般財団法人日本品質保証機構  
九州試験所

所 在 地 福岡県久留米市宮ノ陣三丁目 2 番 33 号

認定の区分 長さ、質量、温度、力、音響・超音波  
(詳細は別紙のとおり)

認定の基準 ISO/IEC 17025:2005  
(JIS Q 17025:2005)

初回認定日：平成 14 年 2 月 4 日

最新交付日：平成 30 年 2 月 2 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構  
認定センター所長 山本 健一



- ・ IA Japan ((独)製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC (国際試験所認定協力機構)及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構)の MRA (相互承認)に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認要求事項とは、認定の基準(該当する国際規格及びガイド)適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期検査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項(方針)を指します。
- ・ この認定は当該事業所が認定された範囲において ISO/IEC 17025:2005 の技術的能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです。ISO/IEC 17025:2005 のマネジメントシステム要求事項は ISO 9001:2008 の原則を満たし、その関連する要求事項に沿ったものです。





登録に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 30 年 2 月 2 日

国際MRA対応初回認定年月日：平成 30 年 2 月 2 日

校正手法の区分の呼称 [登録年月日]：一次元寸法測定器 [平成 30 年 2 月 2 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約95%)
一次元寸法測定器	ノギス	300 mm 以下	0.03 mm
		300 mm 超 500 mm 以下	0.04 mm
		500 mm 超 600 mm 以下	0.05 mm
		600 mm 超 1000 mm 以下	0.07 mm
	マイクロメータ	50 mm 以下	2 μm
		50 mm 超 200 mm 以下	4 μm
		200 mm 超 300 mm 以下	6 μm
		300 mm 超 400 mm 以下	8 μm
		400 mm 超 500 mm 以下	9 μm
	ハイトゲージ	200 mm 以下	0.02 mm
		200 mm 超 500 mm 以下	0.03 mm
		500 mm 超 600 mm 以下	0.04 mm
		600 mm 超 1000 mm 以下	0.05 mm





登録に係る区分：質量

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 14 年 2 月 4 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 14 年 2 月 4 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：分銅等 [平成 30 年 2 月 2 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
分銅等	分銅	20 kg	15 mg
		10 kg	7.0 mg
		5 kg	4.0 mg
		2 kg	1.5 mg
		1 kg	0.50 mg
		500 g	0.40 mg
		200 g	0.15 mg
		100 g	0.080 mg
		50 g	0.050 mg
		20 g	0.040 mg
		10 g	0.045 mg
		5 g	0.030 mg
		2 g	0.020 mg
		1 g	0.015 mg
		500 mg	0.0090 mg
		200 mg	0.0070 mg
		100 mg	0.0060 mg
		50 mg	0.0050 mg
		20 mg	0.0040 mg
		10 mg	
		5 mg	
		2 mg	
		1 mg	
	おもり	50 g 超 20 kg 以下	5.0 μg/g
		20 g 超 50 g 以下	0.25 mg
		10 g 超 20 g 以下	0.20 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.16 mg
		2 g 超 5 g 以下	0.12 mg
		1 g 超 2 g 以下	0.10 mg
		500 mg 超 1 g 以下	0.080 mg
		200 mg 超 500 mg 以下	0.060 mg
		100 mg 超 200 mg 以下	0.050 mg
		50 mg 超 100 mg 以下	0.040 mg
20 mg 超 50 mg 以下		0.030 mg	
10 mg 超 20 mg 以下		0.025 mg	
1 mg 以上 10 mg 以下	0.020 mg		



登録に係る区分：温度

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 16 年 8 月 13 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 16 年 8 月 13 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：接触式温度計 [平成 30 年 2 月 2 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	ガラス製温度計	0 °C	0.06 °C
		-50 °C 以上 0 °C 未満	0.12 °C
		0 °C 超 50 °C 以下	0.09 °C
		50 °C 超 100 °C 以下	0.09 °C
		100 °C 超 150 °C 以下	0.10 °C
		150 °C 超 200 °C 以下	0.10 °C
		200 °C 超 250 °C 以下	0.13 °C
		250 °C 超 300 °C 以下	0.16 °C
		300 °C 超 350 °C 以下	0.18 °C
	指示計器付温度計 (比較校正法)	0 °C	0.06 °C
		-40 °C 以上 0 °C 未満	0.08 °C
0 °C 超 350 °C 以下		0.08 °C	

登録に係る区分：力

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 30 年 2 月 2 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 30 年 2 月 2 日

校正手法の区分の呼称 [登録年月日]：一軸試験機 [平成 30 年 2 月 2 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
一軸試験機	JIS B 7721 による方法	圧縮力	10 N 以上 200 kN 以下	0.20 %
			200 kN 超 5000 kN 以下	0.30 %
		引張力	0.1 N 以上 1 kN 以下	0.14 %
			1 kN 超 300 kN 以下	0.30 %

登録に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 22 年 7 月 2 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 22 年 7 月 2 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：音響測定器等 [平成 30 年 2 月 2 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
音響測定器等	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベ ル：JISC1509-1 準拠)	125 Hz	0.5 dB
		1000 Hz	0.4 dB
		4000 Hz	0.6 dB
		8000 Hz	0.6 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベ ル：JISC1509-1 非準拠)	500 Hz	0.4 dB
		630 Hz	0.4 dB
		800 Hz	0.4 dB
		1000 Hz	0.4 dB
		1250 Hz	0.4 dB
		1600 Hz	0.6 dB
	音響校正器 (音圧レベル、 I 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB
		1000 Hz	0.11 dB
	音響校正器 (音圧レベル、 II 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB
		1000 Hz	0.11 dB
オーディオメータ (I 形)	音圧レベル (イヤホンの出力)	125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.6 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.6 dB
オーディオメータ (II 形)		125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.7 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.9 dB

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
音響測定器等	音響校正器 (音圧レベル、 I 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB
		1000 Hz	0.11 dB
	音響校正器 (音圧レベル、 II 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB
		1000 Hz	0.11 dB